

10/539878  
Rec'd PCT/PTO 15 JUN 2005

特 許 協 力 条 約

REC'D 08 JUL 2004

WIPO

PCT

PCT

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 J SONY-475PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP03/15917	国際出願日 (日.月.年) 12.12.03	優先日 (日.月.年) 16.12.02	
国際特許分類(IPC) Int. Cl <sup>7</sup> G02F1/1334, G02F1/133, G02F1/13			
出願人(氏名又は名称) ソニー株式会社			

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 5 ページからなる。

☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
- II ☐ 優先権
- III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV ☒ 発明の単一性の欠如
- V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI ☐ ある種の引用文献
- VII ☐ 国際出願の不備
- VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 27.02.2004	国際予備審査報告を作成した日 16.06.2004		
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 山口 裕之	2X	2913
電話番号 03-3581-1101 内線 3293			

様式PCT/IPEA/409(表紙)(1998年7月)

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

## IV. 発明の単一性の欠如

1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、

- ☐ 請求の範囲を減縮した。
- ☐ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
- ☐ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。

2. ☒ 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- ☐ 満足する。
- ☒ 以下の理由により満足しない。

以下の理由により、この国際出願は発明の単一性の要件を満たさない3つの発明を含む。

主発明：「クレーム1～3」  
第2発明：「クレーム4～8」  
第3発明：「クレーム9」

請求の範囲1～2を「最初に記載されている発明（「主発明」）」として調査を行った結果、請求の範囲1～3に記載の特徴は、先行技術として、文献1：JP 6-3651 A、文献2：JP 9-68701 Aに開示されているから新規でないことが明らかとなった。したがって、請求の範囲1～3に記載の特徴は、PCT規則13.2の第2文の意味において「特別な技術的特徴」とは認められない。

そして、請求の範囲4～8と上記先行技術とを比較する限りにおいて、第2発明の「（当座の）特別な技術的特徴」は「温度検出部」である。  
一方、請求の範囲9と上記先行技術とを比較する限りにおいて、第3発明の「（当座の）特別な技術的特徴」は「撮像装置」である。

これら主発明と第2～3発明の間に一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係は認められない。

4. したがって、この国際予備審査報告書を作成するに際して、国際出願の次の部分を、国際予備審査の対象にした。

- ☒ すべての部分
- ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_

に関する部分

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)

請求の範囲

4-9

請求の範囲

1-3

有  
無

進歩性 (IS)

請求の範囲

請求の範囲

1-9

有  
無

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲

請求の範囲

1-9

有  
無

## 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 6-3651 A (株式会社リコー)

14. 01. 1994, 全文, 全図

文献2: JP 9-68701 A (大日本インキ化学工業株式会社)

11. 03. 1997, 全文, 全図

文献3: JP 9-304753 A (セイコーインスツルメンツ株式会社)

28. 11. 1997, 全文, 全図

文献4: WO 00/07065 A  
(MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD)

10. 02. 2000, 全文, 全図

& JP 2000-105363 A  
文献5: JP 11-112849 A (住友電気工業株式会社)

23. 04. 1999, 全文, 全図

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

請求の範囲 1～3

請求の範囲 1～3 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1～2 から新規性を有さない。

文献 1 には、対向基板の間隔が  $2 \sim 10 \mu\text{m}$  (【0005】) (特に実施例 1 (【0009】) では  $6 \mu\text{m}$ ) である調光装置が記載されている。

文献 2 には、対向基板の間隔が  $4 \sim 13 \mu\text{m}$  (【0070】) (特に実施例 1 (【0088】) では  $6 \mu\text{m}$ 、実施例 12 (【0170】) では  $9.6 \mu\text{m}$ 、) である調光装置が記載されている。

請求の範囲 4～8

請求の範囲 4～8 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1～4 より進歩性を有しない。

文献 3～4 には、温度検出部と、パルス制御部とを備える液晶装置が記載されている。

文献 1～2 に記載の調光装置と、文献 3～4 に記載の液晶装置とは、互いに密接に関連した技術分野に属するものであるので、文献 3～4 に記載の温度検出部とパルス制御部を、文献 1～2 に記載の調光装置に適用することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

請求の範囲 9

請求の範囲 9 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1～5 より進歩性を有しない。

文献 5 には、調光装置が撮像系の光路中に配されている撮像装置が記載されている。

文献 1～2 に記載の調光装置と、文献 5 に記載の撮像装置とは、互いに密接に関連した技術分野に属するものであるので、文献 1～2 に記載の調光装置を、文献 5 に記載の撮像装置に適用することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。